

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025년 4월 24일 (24.04.2025)



(10) 국제공개번호
WO 2025/084841 A1

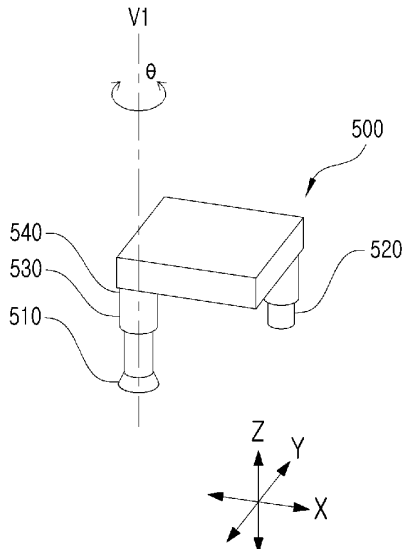
- (51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01) *H01L 21/677* (2006.01)
H01L 21/67 (2006.01) *H01L 21/68* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/015867
- (22) 국제출원일: 2024년 10월 18일 (18.10.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0140575 2023년 10월 19일 (19.10.2023) KR
10-2023-0140845 2023년 10월 20일 (20.10.2023) KR
10-2023-0142139 2023년 10월 23일 (23.10.2023) KR
10-2023-0153756 2023년 11월 8일 (08.11.2023) KR
10-2024-0015568 2024년 2월 1일 (01.02.2024) KR
10-2024-0099476 2024년 7월 26일 (26.07.2024) KR
- (71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/
KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR).
- (72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시
동남구 향교1길 114-7 (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 빛과소금 (LIGHT AND SALT
PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구
가산디지털2로 98, 1-312호 (KR).

- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR REARRANGING ELECTRONIC COMPONENT OF HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러 및 전자부품 테스트용 핸들러의 전자부품 재배치방법



(57) Abstract: The present invention relates to a handler for testing an electronic component. According to the present invention, the handler comprises: a test table on which electronic components are loaded; and a rearrangement mechanism for rearranging the electronic components loaded in the temporary areas of the test table to fixed position areas, wherein the rearrangement mechanism includes a rearrangement picker capable of gripping the electronic components, a rearrangement camera disposed to be spaced apart from the rearrangement picker, and a rotator for rotating the rearrangement picker. When the present invention is applied, the processing capacity of the handler can be improved by reducing the time required for rearranging the electronic components.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품 테스트용 핸들러에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 전자부품들이 적재되는 테스트테이블; 및 상기 테스트테이블의 임시구역들에 적재된 전자부품들을 정위치구역들로 재배치시키기 위한 재배치기구;를 가지며, 상기 재배치기구는 전자부품을 파지할 수 있는 재배치픽커; 상기 재배치픽커와 이격되게 배치되는 재배치카메라; 및 상기 재배치픽커를 회전시키는 회전기;를 포함한다. 본 발명이 적용되면 전자부품의 재배치에 소요되는 시간을 줄여 핸들러의 처리 용량을 향상시킬 수 있다.

WO 2025/084841 A1